

# Öğr.Gör. HALİL İBRAHİM EFKERE

## Kişisel Bilgiler

Cep Telefonu: [+90 553 605 4264](tel:+905536054264)

E-posta: [iefkere@gazi.edu.tr](mailto:iefkere@gazi.edu.tr)

Web: <https://avesis.gazi.edu.tr/iefkere>

## Eğitim Bilgileri

Doktora, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği (Dr), Türkiye 2015 - Devam Ediyor

Yüksek Lisans, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (YI) (Tezli), Türkiye 2010 - 2014

Lisans, Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Türkiye 2005 - 2009

## Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri

## Yaptığı Tezler

Yüksek Lisans, InGaAs/GaAs süperörgü yapılarının moleküler demet epitaksi (MBE) tekniğiyle büyütülmesi ve karakterizasyonu, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (YI) (Tezli), 2013

## Araştırma Alanları

Fizik, Mühendislik ve Teknoloji

## Akademik Unvanlar / Görevler

Öğretim Görevlisi, Gazi Üniversitesi, Fotonik Uygulama Ve Araştırma Merkezi, 2020 - Devam Ediyor

## SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

- I. Investigations of some physical properties of ALD growth ZnO films: effect of crystal orientation on photocatalytic activity**  
POLAT GÖNÜLLÜ M., Cergel M. S., EFKERE H. İ., ATEŞ H.  
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- II. Electrical Properties of MOS Capacitor with TiO<sub>2</sub>/SiO<sub>2</sub> Dielectric Layer**  
Cetin S. Ş., Efkere H. İ., Sertel T., Tataroğlu A., Özçelik S.  
SILICON, cilt.12, sa.12, ss.2879-2883, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- III. The effect of thickness on surface structure of rf sputtered TiO<sub>2</sub> thin films by XPS, SEM/EDS, AFM and SAM**  
Guzelcimen F., Tanoren B., Cetinkaya C., Kaya M. D., Efkere H. İ., Özen Y., Bingol D., Sirkeci M., Kinaci B., Ünlü M. B.,

et al.

VACUUM, cilt.182, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

**IV. Gas Sensing Properties of Cr Doped TiO<sub>2</sub> Films Against Propane**

Comert Sertel B., Efker H. İ., Özçelik S.

IEEE SENSORS JOURNAL, cilt.20, ss.13436-13443, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

**V. Negative capacitance phenomena in Au/SrTiO<sub>3</sub>/p-Si heterojunction structure**

Kınacı B., Çetinkaya Ç., Çokduygulular E., Efker H. İ., Akın Sönmez N., Özçelik S.

JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, cilt.31, ss.8718-8726, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

**VI. The effect of thickness on the optical, structural and electrical properties of ZnO thin film deposited on n-type Si**

Efker H. İ., Tataroğlu A., Cetin S. Ş., Topaloglu N., Gonullu M., Ateş H.

JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, cilt.1165, ss.376-380, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

**VII. Surface structure and photoluminescence properties of AZO thin films on polymer substrates**

Akın Sönmez N., Özen Y., Efker H. İ., Çakmak M., Özçelik S.

SURFACE AND INTERFACE ANALYSIS, cilt.47, ss.93-98, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

## **Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler**

**I. Investigation of the Structural, Morphological, Optical and Electrical Properties of In<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Thin Films: Gas Sensor Applications**

Asar T., Korkmaz B., Efker H. İ., Akın Sönmez N., Özçelik S.

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNİK DERGISI, cilt.21, ss.265-271, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

**II. Structural and Optical Properties of Reactive Sputtered ZnO Thin Films on Flexible-Transparent Substrates**

Akın Sönmez N., Başköse Ü. C., Efker H. İ., Sağlam S., Aydın S. Ş., Özçelik S.

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.27, sa.4, ss.1111-1114, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

## **Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar**

**I. Synthesis and Characterization of Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Thin Film By Using Atomic Layer Deposition**

ÇOLAK T., KUPA İ., ÖZKAN Ö. B., ÜNAL Y., EFKERE H. İ., POLAT GÖNÜLLÜ M., ATEŞ H.

8th International Advanced Technologies Symposium, 19 - 22 Ekim 2017

## **Atıflar**

Toplam Atıf Sayısı (WOS):42

h-ineksi (WOS):3